## 軟 X 線光電子分光によるバルク電子状態測定: バルクバンドマッピングと Fermiology

## 菅 滋正 大阪大学大学院基礎工学研究科

これまでバルク電子物性と光電子分光で結果が大きく異なることが報告されていた種々の Ce 化合物についての 3d-4f 共鳴光電子分光の結果は、4d-4f 共鳴光電子分光の結果と顕著に異なり、近藤温度が数百 K 以下の物質では結晶場分裂を考慮すればバルクの近藤温度  $T_{\kappa}$ でよくスケールできることが分かった.つまり 4d-4f 光電子スペクトルは局在的な表面電子状態を観測していたことが多くの Ce 化合物で明らかになり、研究のブレークスルーが得られた.

同様に論争の続いている Yb 化合物においても、100eV とかそれ以下のエネルギーでの光電子スペクトルに比べて数百 eV 励起のスペクトルは表面の Yb²+からくる4 f ピーク強度が劇的に減少し、deconvolution を行ってバルクの近藤ピーク成分を評価する際の精度が飛躍的に向上した.たとえば表面第2層(サブサーフェス)からの顕著な寄与が価数転移を著しく不鮮明にしていた YbInCu4 においても価数転移が狭い温度範囲で起こることが確かめられ、バルク敏感性の向上がバルク電子状態の議論には不可欠であることが示された.

バルクと表面の電子状態の違いはこのように Ce,Yb,Sm などの希土類系ではもはや疑う余地が無いが、3d 遷移金属化合物の電子状態においても慎重な議論が必要とされる.はじ

めに Sr<sub>1-x</sub>Ca<sub>x</sub>VO<sub>3</sub>の V3d スペクトルを HeI, HeII, 275eV、900eV で測定したところ、高エネルギーになるにしたがってフェルミ準位近傍のいわゆるコヒーレントピークが 1.8eV 付近のインコヒーレントピークいわゆる下部ハバードバンドに由来するピークに比べて増大することが分かった.幸い 200eV を越える領域では平均自由行程の計算が比較的信頼できるのでそれを用いるとバルクと表面のスペクトルを実験的に分離することが可能である.

その結果は驚くべきことに、 $SrVO_3$ から  $CaVO_3$ に行くにしたがって 3d 電子の遍歴性が減少するにもかかわらず、バルクスペクトルは殆ど変化しないとの結果となった.これまで表面敏感な HeI や HeII スペクトルでは  $SrVO_3$  と  $CaVO_3$ ではスペクトルが大きく異なる、これを電子相関の立場から議論してきたわけであるが、このようなバルク電子状態の議論は適切でなかったことが分かった.我々の実験ではバルク成分を deconvolute したあとの表面スペクトルは HeI スペクトルに酷似しており、HeI 励起ではこの系の場合でも表面スペクトルを観測していたことが分かった.

つぎにそれではこのようなバルク敏感測定が角度分解光電子分光としてバルクバンドマッピングや Fermiology に使えるかの検討を行った.これまで高エネルギーの角度分解光電子分光は光電子回折の手法で表面構造解析に利用されていたが、フォノンとの散乱により波数ボケが生じ、バンドマッピングには使えないと言うのが常識であった.しかし300Kでの SrCuO2の試料ではバンド分散がきわめて明快に観測され、波数分布曲線 MDC ではそのV字型分散が明瞭である.エネルギー分解能と角度分解能が十分であれば、バルク敏感ARPES が実用になることがはじめて示された.今後多くの強相関物質で、バルク敏感モードでのフェルミオロジーが発展することと思われる.